

GERÄT Fischerscope	DETEKTOR	MESSBARE ELEMENTE	EINSATZGEBIETE	BESONDERHEITEN
<b>XDV-SDD50</b>	Hochauflösender Silizium-Drift-Detektor (SDD)	ab Z=13 (Aluminium) bis Z=92 (Uran)	sehr dünne Schichten, Spurenanalysen und Legierungszusammensetzungen	Programmierbarer XYZ-Messtisch
<b>XDVM-W</b>	Proportionalzählrohr	ab Z=17 (Chlor) bis Z=92 (Uran)	Variable Messabstände, kurze Messzeiten	Programmierbarer XYZ-Messtisch
<b>XDAL</b>	Si-Pin-Halbleiterdetektor	ab Z=17 (Chlor) bis Z=92 (Uran)	dünne Schichten, Spurenanalysen	Programmierbarer XYZ-Messtisch
<b>XUV 773 (Vakuum-RFA)</b>	Hochauflösender Silizium-Drift-Detektor (SDD)	ab Z=11 (Natrium) bis Z=92 (Uran)	Direktmessung von NiP-Schichten, Leichtmetall- und Spurenanalysen	Evakuierbare Messkammer für Messungen an Luft, im Vakuum oder unter Helium, programmierbarer XYZ-Messtisch
<b>XAN</b>	Si-Pin-Halbleiterdetektor	Z=17 (Chlor) bis Z=92 (Uran)	Gold- und Edelmetallanalysen in der Schmuck und Uhrenindustrie, Stahl- und Buntmetallanalysen, Spurenanalysen	Einfache Probenpositionierung (Messrichtung von unten nach oben)